

SCHLEIFTAGUNG

2024

Oberflächenrauheit

Neuerungen aus der DIN EN ISO 21920

Dr. Christoph Blum | MAHR GmbH

Abstract Wenn heutzutage an die Oberflächenrauheit gedacht wird, kennen die meisten Prozessbeteiligten nur die Parameter Ra und Rz. Diese Parameter werden seit jeher für die Prozesssteuerung in der Fertigung genutzt und sie können grundsätzliche Eigenschaften der geprüften Oberflächen und des zugrunde liegenden Produktionsprozesses beschreiben.

Allerdings ist die Aussagekraft dieser Kenngrößen sehr beschränkt vor allem, wenn es um Fragen der Funktionseigenschaften von Oberflächen geht. In der Neufassung der ISO Oberflächenrauheit (DIN EN ISO 21920 2022) für Profile wurde der generelle Blickwinkel so verschoben, dass in der ISO 21920 die Oberflächen in größerem Maße aus Sicht der Funktion beschrieben werden.

Know-How im Bereich der Oberflächenrauheit ist daher besonders mit der neuen Norm wichtiger denn je, um effizient produzieren zu können.



Dr. Christoph Blum

MAHR GmbH

Lebenslauf

2008-2010	B.Sc. Physik Universität Münster
2008-2011	Diplomstudium Mathematik Diplomstudium Physik Universität Münster
2011-2015	Promotion zum Dr. der Physik Georg-August-Universität Göttingen
2011-2016	Wissenschaftlicher Mitarbeiter Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization
Seit 2016	Anwendungsingenieur Mahr GmbH
Seit 2017	Manager Mahr Academy